

Nyhetsbrev från Medfield Diagnostics AB 2018-10-31

Amerikanska patentverket avser att bevilja Medfield Diagnostics patent för system med självlärande klassificeringsalgoritm

Det amerikanska patentverket har idag har meddelat Medfield Diagnostics att man har för avsikt att godkänna (så kallad intent to grant) Medfield Diagnostics patentansökan gällande mikrovågstomografi, "LINEAR CLASSIFICATION OF MICROWAVE SCATTERING DATA", med ansökningsnummer **13/386,521**. Patentet täcker framförallt Medfield Diagnostics nuvarande system med en självlärande klassificeringsalgoritm för att diagnosticera patienter.

Diagnostik med hjälp av självlärande klassificeringsalgoritmer, som tränas på mätdata från patienter och friska frivilliga, utgör grunden i Medfields unika teknik. Att detta patent nu avses beviljas är ett viktigt steg för Medfield, som nu erhåller ett långsiktigt skydd och en bas för vidare utveckling. Inom bolaget fortsätter vi att utveckla och förfinas denna teknik som redan idag används i kliniska studier, säger Stefan Blomsterberg, VD i Medfield Diagnostics.

Frågor besvaras av Stefan Blomsterberg, VD i Medfield Diagnostics AB på tel. 0723058700 eller stefan.blomsterberg@medfelddiagnostics.com

Följ oss gärna på www.medfelddiagnostics.com

